

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



249769

**การหาผลสัมฤทธิ์ของยาสมุนไพรโรดิโอเดอริกปราศจากพิษที่มีนิรภัยต่อสิ่งแวดล้อม
โดยหาผลเป็นองค์ประกอบหลัก ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการแพทย์พื้นบ้าน**

พงศ์ภค ฉิมฉิมเพชรภรณ์

วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม เพื่อเป็นนักร่วมวิชาชีพของเภสัชกรศึกษา

วิทยาลัยการปริชญ์บูรณาการศาสตร์สุขภาพบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาที่จัดการประชุม

พฤษภาคม 2555

ฉิมฉิมเพชรภรณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา



การหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟอร์ไรต์เล็กทริกปราศจากตะกั่วที่มีบิสมัทโซเดียม
ไททานตเป็นองค์ประกอบหลัก ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้



ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์

วิทยานิพนธ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

พฤษภาคม 2555

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การหาลักษณะเฉพาะของ เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกปราศจากตะกั่วที่มีบิสมาทโซเดียมไททานเนตเป็นองค์ประกอบหลัก ที่เตรียม ด้วยวิธีการเผาใหม่” ของ ปนัดดา สิทธิเชตรกรณ์ เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร



.....ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชिरาณี ขำล้ำเลิศ)



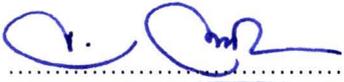
.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ)



.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโทหญิง ดร.นิภาภัทร เจริญไทย)



.....กรรมการ

(ดร.ศราวดี เกื้อนถ้ำ)



.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฤทธิเดช)

อนุมัติ



.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิงนิจ ภูพัฒน์วิบูลย์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

11 พฤษภาคม 2555

ประกาศคุณูปการ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณั ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุทิศส่วสเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการวิทยานิพนธ์อันประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโทหญิง ดร. นิภาภัทร เจริญไทย ดร.ศรารุณี เกื้อนถ้ำ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิราณี ชำล้าเลิศ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุวรรณ ฤทธิเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทำให้งานวิจัยนี้มีความทรงคุณค่าแห่งการศึกษา

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานวิจัย

ขอขอบคุณโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ที่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้วิจัยตลอดหลักสูตรการศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในทุน MAG Window II ที่ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยในครั้งนี้

คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดาซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และผู้มีพระคุณทุกท่าน

ท้ายสุด หากมีสิ่งขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงในข้อบกพร่องและผิดพลาดนั้น และข้าพเจ้าหวังว่างานวิจัยนี้คงมีประโยชน์ไม่มากนักน้อยสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อไป

ปนัดดา สิทธิเชตรกรณ์

ชื่อเรื่อง	การหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริกปราศจากตะกั่วที่มีบิสมาทไซเดียมไททานेटเป็นองค์ประกอบหลัก ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
ผู้วิจัย	ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์
ประธานที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีระชัย บงการณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโทหญิง ดร. นิภาภัทร เจริญไทย ดร.ศราวุฒิ เกื้อนถ้ำ
ประเภทสารนิพนธ์	วิทยานิพนธ์ วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554
คำสำคัญ	บิสมาทไซเดียมไททานेट แบเรียมไททานेट แคลเซียมไททานेट สทรอนเซียมไททานेट วิธีการเผาไหม้การเผาไหม้ เฟอร์โรอิเล็กทริก ที่ปราศจากตะกั่ว

บทคัดย่อ

249769

ศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริกปราศจากตะกั่วที่มีบิสมาทไซเดียมไททานेटเป็นองค์ประกอบหลัก ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ เซรามิกในระบบ $1-x(\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5})\text{TiO}_3-x\text{ATiO}_3$ [$A = \text{Ba}^{2+}, \text{Ca}^{2+}$ และ Sr^{2+}] หรือ BNTBT100x, BNTCT100x และ BNTCT100x โดยที่ $x = 0-0.12, 0-0.08$ และ $0-0.12$ ตามลำดับ โดยซินเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1050 และ 1210 องศาเซลเซียส ศึกษาโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค ความหนาแน่น ขนาดเกรนเฉลี่ย และสมบัติทางไฟฟ้าของตัวอย่างด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) วิธีของอาร์คิมิดีส วิธีหาค่าเฉลี่ยเชิงเส้น เครื่องวัดไดอิเล็กทริก LCR เครื่องวัดสมบัติเฟอร์โร อิเล็กทริก และเครื่องวัดสมบัติพิโซอิเล็กทริก ตามลำดับ

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTBT100x พบว่ามีโครงสร้างแบบผสมของรอมโบอีดรอลและเทตระโนอล ที่ $x \leq 0.04$ เซรามิกมีโครงสร้างเป็นแบบรอมโบอีดรอลซึ่งเหมือนกับ BNT เมื่อปริมาณ BT เพิ่มขึ้น เซรามิกมีความเป็นเทตระโนอลลึ้มมากขึ้น ในขณะที่ $x \geq 0.10$ เซรามิกมีโครงสร้างเป็นแบบเทตระโนอลซึ่งเหมือนกับ BT ผลจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก BNTBT100x พบว่ารูปร่างเกรนส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายทรงกลมและสี่เหลี่ยมมุมฉาก เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิซินเตอร์เดียวกันขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิกมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น

สำหรับเซรามิก BNTBT2 และ BNTBT4 ค่าความหนาแน่น ค่าความหดตัวเชิงเส้น และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจนถึง 1150 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจะเกิดการระเหยของ Bi^{3+} และ Na^+ . ในขณะที่เซรามิก BNTBT6 BNTBT8 BNTBT10 และ BNTBT12 ค่าความหนาแน่น ค่าความหดตัวเชิงเส้น และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจนถึง 1200 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจะพบเฟสแปลกปลอม นอกจากนั้น เซรามิก BNTBT8 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรีสูงสุด ค่าความหนาแน่นสูงสุด ค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก โดยมีค่าประมาณ 7400 5.80 g/cm^3 และ 169 pC/N ตามลำดับ และมี ค่า P_r และ E_c (ใช้สนามไฟฟ้าเพิ่ม 40 kV) เท่ากับ 28.10 $\mu\text{C/cm}^3$ และ 21.02 kV/cm ตามลำดับ

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก BNTCT100x พบว่ามีโครงสร้างแบบบรอมโบอีตรอลในทุกๆตัวอย่าง และผลจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบว่ารูปร่างเกรนส่วนใหญ่ของเซรามิกมีลักษณะคล้ายทรงกลมและสีเหลี่ยมมุมฉาก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นขนาดเกรนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจนถึง 1150 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นความหนาแน่นมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้น ในขณะที่การหดตัวเชิงเส้นมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเซรามิก BNTCT2 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรี สูงสุดค่าความหนาแน่นสูงสุด และค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก โดยมีค่าประมาณ 3208 5.57 g/cm^3 และ 40 pC/N ตามลำดับ และมี ค่า P_r และ E_c (ใช้สนามไฟฟ้าเพิ่ม 40 kV) เท่ากับ 17.4 $\mu\text{C/cm}^3$ และ 30.13 kV/cm ตามลำดับ

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก BNTST100x พบว่ามีโครงสร้างแบบคิวบิกในทุกๆตัวอย่าง และผลจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบว่ารูปร่างเกรนส่วนใหญ่ของเซรามิกมีลักษณะคล้ายทรงกลมและสีเหลี่ยมมุมฉาก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นขนาดเกรนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ค่าความหนาแน่น และการหดตัวเชิงเส้นมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเซรามิก BNTST20 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรีสูงสุด ค่าความหนาแน่นสูงสุด และค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก โดยมีค่าประมาณ 4725 5.57 g/cm^3 และ 90 pC/N ตามลำดับ และมี ค่า P_r และ E_c (ใช้สนามไฟฟ้าเพิ่ม 40 kV) เท่ากับ 17.19 $\mu\text{C/cm}^3$ และ 29.61 kV/cm ตามลำดับ

Title CHARACTERIZATION OF LEAD-FREE BISMUTH SODIUM
TITANATE BASED FERROELECTRIC CERAMICS PREPARED
VIA COMBUSTION METHOD

Author Panadda Sittiketkorn

Advisor Assistant Professor Theerachai Bongkarn, Ph.D.

Co-Advisor Assistant Professor Lieutenant Junior Grade
Nipaphat Charoenthai, Ph.D.
Sarawut Thountom, Ph.D.

Academic Paper Thesis M.S. in Applied Physics, Naresuan University, 2011

Keyword bismuth sodium titanate, barium titanate, calcium titanate,
strontium titanate, combustion technique, lead-free ferroelectric

ABSTRACT

249769

Characterization of lead-free bismuth sodium titanate based ferroelectric ceramics prepared via combustion method was studied. $1-x(\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5})\text{TiO}_3-x\text{ATiO}_3$ [A = Ba^{2+} , Ca^{2+} and Sr^{2+}] BNTBT100x, BNTCT100x and BNTST100x with $x = 0-0.12$, $0-0.08$ and $0-0.12$, were sintered between 1050 and 1210 °C. The crystal structure, microstructure, density, average grain sizes and electrical properties of the samples were investigated using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), the Archimedes method, the mean linear intercept method, a LCR impedance analyzer, a ferroelectric test system and a quasistatic d_{33} meter.

The XRD results of BNTBT100x ceramics showed mixed of rhombohedral and tetragonal phase. For $x \leq 0.04$, the sintered pellets were indexed in rhombohedral system which was similar to pure BNT. The tetragonality increased with increase BT content. While $x \geq 0.10$, the sintered pellets were indexed in tetragonal system which was similar to pure BT ceramics. The microstructure of BNTBT100x ceramics exhibited an almost spherical and irregular shape. The average grain size of the samples increased with the increase of sintering temperatures, while the grain sizes decreased with the increase of BT content. The density, linear shrinkage and maximum dielectric

constant of BNTBT2 and BNTBT4 ceramics increased with increasing sintering temperatures up to 1150 °C and then evaporation of Bi^{3+} and Na^+ . While, the density, linear shrinkage and maximum dielectric constant of BNTBT6 BNTBT8 BNTBT10 and BNTBT12 ceramics increased with increasing sintering temperatures up to 1200 °C and then the impurity phases were detected at higher sintering temperatures. Moreover, the BNTBT8 ceramics sintered at 1200 °C showed the highest dielectric constant at T_c , highest density and highest piezoelectric constant of 7400, 5.80 g/cm³ and 169 pC/N, respectively. The P_r and E_c (using electric field at 40 kV) were 28.10 $\mu\text{C}/\text{cm}^3$ and 21.02 kV/cm, respectively.

The XRD results of BNTCT100x ceramics exhibited the rhombohedral phase in all the sample. The microstructure of BNTCT100x ceramics exhibited an almost spherical and irregular shape. The average grain size of the samples increased with the increase of sintering temperatures. The density of BNTCT100x ceramics increased with increasing sintering temperatures up to 1150 °C and thereafter they decreased. The linear shrinkage of BNTCT100x ceramics increased with increasing sintering temperatures. Moreover, the BNTCT2 ceramics sintered at 1150 °C showed the highest dielectric constant at T_c , highest density and highest piezoelectric constant of 3208, 5.57 g/cm³ and 40 pC/N, respectively. The P_r and E_c (using electric field at 40 kV) were 17.4 $\mu\text{C}/\text{cm}^3$ and 30.13 kV/cm, respectively.

The XRD results of BNTST100x ceramics exhibited the cubic phase in all the sample. The microstructure of BNTST100x ceramics exhibited an almost spherical and irregular shape. The average grain size of the samples increased with the increase of sintering temperatures. The density and linear shrinkage of BNTST100x ceramics increased with increasing sintering temperatures. Moreover, the BNTST20 ceramics sintered at 1200 °C showed the highest dielectric constant at T_c , highest density and highest piezoelectric constant of 4725, 5.57 g/cm³ and 90 pC/N, respectively. The P_r and E_c (using electric field at 40 kV) were 17.19 $\mu\text{C}/\text{cm}^3$ and 29.61 kV/cm, respectively.

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาของปัญหา.....	1
จุดมุ่งหมายของการศึกษา.....	3
ขอบเขตของงานวิจัย.....	3
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
เฟอร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectric).....	4
สมบัติพิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric property).....	8
พาราอิเล็กทริก (Paraelectric).....	9
เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer).....	10
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(Scanning Electron Microscope).....	14
หลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด.....	14
การซินเตอร์.....	16
การหาความหนาแน่น (Density).....	20
การเตรียมเซรามิกด้วยวิธีการเผาไหม้.....	21
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	23
3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง.....	32
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	32
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสาร.....	32
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง.....	32
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง.....	33
วิธีการทดลอง.....	33

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 ผลการวิจัย.....	39
ผลการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของผงผลึกบิส്മัทไซเดียมไททานेट ผงผลึกแบเรียมไททานेट ผงผลึกแคลเซียมไททานेट และผงผลึก สทรอนเซียม ไททานेट.....	39
ผลการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของเซรามิกบิส്മัทไซเดียมไททานेट- แบเรียมไททานेट เซรามิกบิส്മัทไซเดียมไททานेट-แคลเซียม ไททานेट และเซรามิกบิส്മัทไซเดียมไททานेट-สทรอนเซียม ไททานेट.....	42
5 บทสรุป.....	102
สรุปการตรวจสอบผงผลึกบิส്മัทไซเดียมไททานेट ผงผลึกแบเรียมไททานेट ผงผลึกแคลเซียมไททานेट และผงผลึกสทรอนเซียมไททานेट.....	102
สรุปการตรวจสอบเซรามิกบิส്മัทไซเดียมไททานेट-แบเรียมไททานेट (1-x) BNT-xBT; BNTBT100x.....	102
สรุปการตรวจสอบเซรามิกบิส്മัทไซเดียมไททานेट-แบเรียมไททานेट (1-x) BNT-xCT; BNTCT100x.....	103
สรุปการตรวจสอบเซรามิกบิส്മัทไซเดียมไททานेट-แบเรียมไททานेट (1-x) BNT-xST; BNTST100x.....	103
บรรณานุกรม.....	105
ประวัติผู้วิจัย.....	110

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1	แสดงค่าแลตทิซแสดงความเป็นรอมโบอีตรอล ค่าคงที่แลตทิซและอัตราส่วน c/a ของเซรามิก BNTBT100x	50
2	แสดงขนาดเกรนเฉลี่ย ความหนาแน่น และการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิก BNTBT100x ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ.....	59
3	แสดงขนาดเกรนเฉลี่ย ความหนาแน่น และการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิก BNTBT100x ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส.....	60
4	แสดงอุณหภูมิ depolarization (T_d) อุณหภูมิคูรี (T_m) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ϵ_r) ที่ T_m ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก ($\tan \delta$) ที่ T_m ของเซรามิก BNTBT100x ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ.....	67
5	แสดงค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก (d_{33}) โพลาริเซชันอิมิตัว (P_s) โพลาริเซชันคงค้าง (P_r) และสนามไฟฟ้าลบล้าง (E_c) ของเซรามิก BNTBT8.....	69
6	แสดงขนาดเกรนเฉลี่ย ความหนาแน่น การหดตัวเชิงเส้น และ แลตทิซพารามิเตอร์ a_R ของเซรามิก BNTBT100x ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ.....	79
7	แสดงอุณหภูมิ depolarization (T_d) อุณหภูมิคูรี (T_m) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ϵ_r) ที่ T_m ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก ($\tan \delta$) ที่ T_m ของเซรามิก BNTCT100x	83
8	แสดงค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก (d_{33}) โพลาริเซชันอิมิตัว (P_s) โพลาริเซชันคงค้าง (P_r) และสนามไฟฟ้าลบล้าง (E_c) ของเซรามิก BNTCT2.....	85
9	แสดงขนาดเกรนเฉลี่ย ความหนาแน่น การหดตัวเชิงเส้น และแลตทิซพารามิเตอร์ a_R ของเซรามิก BNTST100x ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ	95
10	แสดงค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก (d_{33}) โพลาริเซชันอิมิตัว (P_s) โพลาริเซชันคงค้าง (P_r) และสนามไฟฟ้าลบล้าง (E_c) ของเซรามิก BNTST20 และ BNTST30.....	101

สารบัญญภาพ

ภาพ		หน้า
1	แผนภาพแสดงการแบ่งกลุ่มพีซีโอเล็กทริกและกลุ่มย่อย.....	4
2	ความต่างเฟสระหว่างกระแสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (V) ของวัสดุไดอิเล็กทริก (a)กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน (b) กรณีมีการสูญเสียพลังงาน.....	7
3	วงรอบฮีสเทอรีซิสระหว่างโพลาริเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารเฟอร์โรอิเล็กทริก	8
4	ปรากฏการณ์พีซีโอเล็กทริกในวัสดุ (ก) แบบตรง (ข) แบบผกผัน.....	9
5	วงรอบฮีสเทอรีซิสระหว่างโพลาริเซชันกับสนามไฟฟ้าใน (a) สารแอนติเฟอร์โร- อิเล็กทริก (b) สารพาราอิเล็กทริก.....	10
6	แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของแบรกก์	12
7	แสดงพฤติกรรมการขึ้นเตอรแบบสถานะของแข็งทั่ว ๆ ไปในรูปของ ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา	17
8	แสดงพัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการขึ้นเตอรแบบสถานะ ของแข็ง (a) อนุภาคฝังยัดกันอยู่แบบหลวม ๆ หลังการอัดขึ้นรูป (b) การขึ้นเตอรช่วงเริ่มต้น (c) การขึ้นเตอรช่วงกลาง และ (d) การขึ้นเตอรช่วง สุดท้าย.....	18
9	การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเผาไหม้.....	22
10	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNBT ที่โพล (ϵ_{33}^T) และไม่ได้โพล (ϵ_s).....	23
11	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและการสูญเสียไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNBT-5 ($x =$ 0.05).....	24
12	วงรอบฮีสเทอรีซิสของเซรามิก BNBT-5 (a) ที่อุณหภูมิห้อง (b) ที่อุณหภูมิ160 องศาเซลเซียส.....	24
13	ความสัมพันธ์ของปริมาณ $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$ และ BaTiO_3 ในระบบ $(\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5})_{1-x}$ Ba_xTiO_3 โดยที่ F_α คือเฟสเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างแบบรอมโบฮีดรอล F_β คือเฟสเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างแบบเทตระโกนอล AF คือเฟสแอน ติเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างแบบรอมโบฮีดรอล P คือเฟสพาราอิเล็กทริก	25
14	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก $(1-x)\text{BNT}-x\text{BT}$	26

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า	
15	แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของ เซรามิก (1-x)BNT-xBT ที่เผาซินเตอร์ที่ 1200 องศาเซลเซียส โดย (a) $x = 0$ และ (b) $x = 0.06$	26
16	แสดงค่า d_{33} , k_p , ϵ_r และ $\tan\delta$ ของเซรามิก(1-x)BNT-xBT	27
17	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก (1-x)BNT-xBT ที่ปริมาณ x ต่างๆ.....	28
18	ค่าคงที่พิโซอิเล็กทริกและค่าสัมประสิทธิ์ไฟฟ้าเชิงกลของเซรามิก (1-x)BNT-xBT ที่ปริมาณ x ต่างๆ.....	28
19	ค่าคงที่แลตทิซและค่าแลตทิซแสดงความเป็นรอมโบฮีดรอล ($90^\circ - \alpha$) ของ เซรามิกBNCT100x และ BNST100x ที่ปริมาณ x ต่างๆ	29
20	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNST100x ที่ปริมาณ x ต่างๆ (a) $x=0.04$ (b) $x=0.08$, (c) $x=0.14$, (d) $x=0.20$ และ (e) $x=0.24$ โดยวัดที่ความถี่10kHz	30
21	ค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก, d_{33} ของ BNBT100x, BNST100x และ BNCT100x ที่ ปริมาณ x ต่างๆ.....	31
22	แสดงขั้นตอนการซินเตอร์เซรามิกเซรามิกบิสมาทโซเดียมไททานต-แคลเซียม ไททานต (BNTCT) เซรามิกบิสมาทโซเดียมไททานต-สทรอนเซียมไททานต (BNTST) และเซรามิกบิสมาทโซเดียมไททานต-แบเรียมไททานต (BNTBT)	38
23	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึกบิสมาทโซเดียมไททานต ($\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$) ผงผลึกแบเรียมไททานต(BaTiO_3) ผงผลึกแคลเซียม ไททานต(CaTiO_3) และผงผลึกสทรอนเซียมไททานต(SrTiO_3) ที่เตรียม ด้วยวิธีเผาใหม่.....	40
24	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของผงผลึกต่างๆ โดยที่ (ก) ผงผลึกบิสมาทโซเดียม ไททานต (ข) ผงผลึกแบเรียมไททานต (ค) ผงผลึกแคลเซียมไททานต และ (ง) ผงผลึกสทรอนเซียมไททานต.....	41

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ		หน้า
25	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTBT2 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ	43
26	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTBT4 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ	44
27	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTBT6 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ	45
28	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTBT8 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ	46
29	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTBT10 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ ต่างๆ.....	47
30	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTBT12 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ ต่างๆ.....	48
31	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTBT100x (a) $x = 0.02$ ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส (b) $x = 0.04$ ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส (c) $x = 0.06$ ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส (d) $x = 0.08$ ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส (e) $x = 0.10$ ซินเตอร์ ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส และ (f) $x = 0.12$ ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส.....	49
32	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTBT2 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส และ (ค) 1150 องศาเซลเซียส.....	52
33	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTBT4 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส และ (ค) 1150 องศาเซลเซียส.....	53
34	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTBT6 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส (ง) 1200 องศาเซลเซียส และ (จ) 1210 องศาเซลเซียส.....	54
35	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTBT8 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส (ง) 1200 องศาเซลเซียส และ (จ) 1210 องศาเซลเซียส.....	55

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ		หน้า
36	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTBT10 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส (ง) 1200 องศาเซลเซียส และ (จ) 1210 องศาเซลเซียส.....	56
37	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTBT12 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส (ง) 1200 องศาเซลเซียส และ (จ) 1210 องศาเซลเซียส.....	57
38	ภาพถ่ายบริเวณรอยหักของเซรามิก BNTBT8 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	58
39	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTBT2 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	62
40	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTBT4 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	63
41	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTBT6 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	63
42	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTBT8 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	64
43	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTBT10 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	64
44	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTBT12 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	65
45	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTBT100x ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050 – 1200 องศาเซลเซียส.....	65
46	T_g และ T_m ของเซรามิก BNTBT100x ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส	66
47	วงรอบฮิสเทอรีซิสของเซรามิก BNTBT8 ที่ค่าสนามไฟฟ้าต่างๆ.....	68
48	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTCT2 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ.....	71
49	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTCT4 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ.....	72

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ		หน้า
50	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTCT6 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ	73
51	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTCT8 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ ต่างๆ.....	74
52	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTCT2 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	76
53	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTCT4 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	76
54	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTCT6 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	77
55	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTCT8 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	77
56	ภาพถ่ายบริเวณรอยหักของเซรามิก BNTCT2 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	78
57	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTCT2 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	81
58	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTCT4 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	81
59	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTCT6 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	82
60	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก BNTCT8 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	82
61	วงรอบฮิสเทอรีซิสของเซรามิก BNTBT8 ที่ค่าสนามไฟฟ้าต่างๆ.....	84
62	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTST10 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ ต่างๆ.....	87

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ		หน้า
63	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTST20 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ ต่างๆ.....	88
64	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTST30 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ ต่างๆ.....	89
65	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNTST40 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ ต่างๆ.....	90
66	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTST10 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	92
67	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTST20 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	92
68	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTST30 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	93
69	ภาพถ่ายบริเวณผิวหน้าของเซรามิก BNTST40 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศา เซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	93
70	ภาพถ่ายบริเวณรอยหักของเซรามิก BNTST20 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ (ก) 1050 องศาเซลเซียส (ข) 1100 องศาเซลเซียส (ค) 1150 องศาเซลเซียส และ (ง) 1200 องศาเซลเซียส.....	94
71	ค่าคงที่ได้อิเล็กทริกของเซรามิก BNTST10 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	97
72	ค่าคงที่ได้อิเล็กทริกของเซรามิก BNTST20 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	97
73	ค่าคงที่ได้อิเล็กทริกของเซรามิก BNTST30 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	98
74	ค่าคงที่ได้อิเล็กทริกของเซรามิก BNTST40 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ.....	98

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ		หน้า
75	วงรอบฮิสเทอรีซิสของเซรามิก BNTST20 ที่ค่าสนามไฟฟ้าต่างๆ.....	99
76	วงรอบฮิสเทอรีซิสของเซรามิก BNTST30 ที่ค่าสนามไฟฟ้าต่างๆ.....	100